

半導体物理のおさらい(2)

電子統計

1. 電子密度

$$n = \int f(E)g(E)dE$$

ここで、

$$f(E) = \left[1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) \right]^{-1} \text{ は Fermi-Dirac 分布関数、 } E - E_F \gg kT \text{ のとき}$$

$$f(E) = \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) \text{ (Boltzmann 分布)}$$

2. 3次元の放物線バンド

$$g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi}{h^3} m^{*3/2} (E - E_C)^{1/2} \text{ より}$$

電子密度は

$$n = \int_{E=E_C}^{\infty} f(E)g(E)dE = N_C \exp\left[\frac{E_F - E_C}{kT}\right] \text{ (Boltzmann 近似)}$$

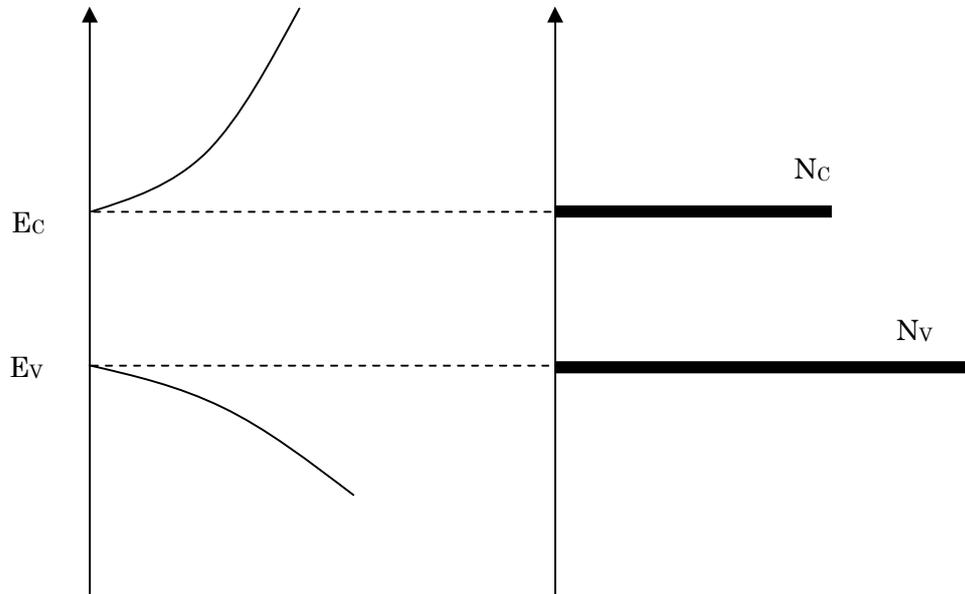
$$\text{ただし、 } N_C = 2 \left(\frac{2\pi m^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \text{ は伝導体の有効状態密度、単位は } [\text{cm}^{-3}]$$

同様にホール密度は

$$p = \int_{-\infty}^{E=E_V} (1 - f(E))g(E)dE = N_V \exp\left[\frac{E_V - E_F}{kT}\right] \text{ (Boltzmann 近似)}$$

$$\text{ただし、 } N_V = 2 \left(\frac{2\pi m_v^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \text{ は荷電子帯の有効状態密度、単位は } [\text{cm}^{-3}]$$

3. 有効状態密度のイメージ



すべての状態をバンド端に集めてエネルギー的にはひとつのレベルがあるようにしたのが有効状態密度。したがって、この値に単に Boltzmann 因子をかければ電子密度（ホール密度）が求まる。

4. np 積(質量作用則)

$$np = N_C N_V \exp\left[\frac{E_V - E_C}{kT}\right] = N_C N_V \exp\left[-\frac{E_g}{kT}\right] = n_i^2 = \text{const.}$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} \exp\left[-\frac{E_g}{2kT}\right]$$

n_i : 真性キャリア濃度

5. 不純物順位

ドナー：電子を放出して正に帯電する順位

アクセプター：電子を捕獲して負に帯電する順位

練習問題

- 1) 1次元、2次元、3次元の放物線バンドにおいて、バンド端から $3kT$ 程度低エネルギーに E_F があるとき、電子分布をエネルギーの関数として図示せよ。次元によって電子分布の半値幅はどう変わるか？
- 2) 下図のエネルギーにおいて伝道帯の有効状態密度 N_c を用いて伝導体の電子密度とドナーレベルにある電子の比を求めよ。(ただし、ドナーレベルの縮退は無視する)

注: $\frac{n}{N_d^0}$ を log-log でプロットし、 $\frac{n}{N_d^0 + n}$ をセミログでプロットせよ(横軸は N_d 、範囲は

10^{15} - 10^{20})。ただし、 N_d^0 はイオン化していないドナー密度。

a) Siの場合: $N_c=2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $E_c - E_d = 25 \text{meV}$

b) GaAsの場合: $N_c=4.7 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$, $E_c - E_d = 5 \text{meV}$

c) GaAs で 10^{18}cm^{-3} 以上の電子濃度を得ることは可能か？

